

Infineon Technologies und das Institut für Elektronik der TU Graz laden ein zu einer Informationsveranstaltung zum Thema

„Testen Integrierter Schaltkreise“



Im Rahmen der Vorlesung „Production Test and Design for Test“ aus dem Ausbildungsschwerpunkt Analog Chip Design wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Infineon Vertreter von namhaften Herstellern als Vortragende für diese Veranstaltung gewonnen. Sie werden entsprechend ihrer Kernkompetenzgebiete zu spezifischen Fragen des Testens integrierter Schaltungen Stellung nehmen und ihre Produkte vorstellen. Im Anschluss ist jeweils Zeit für Fragen vorgesehen.

Ort: Graz, 8010 Graz, Inffeldgasse 13, HS i8

Termin: Mittwoch 27.06.2018, 8:30 -11:35

Von	Bis	Hörsaal i8, Inffeldgasse 13	
08:30	08:40	Begrüßung und Einleitung (Reinhard Teschl, Armin Lammer)	
08:40	09:20	Fa. Teradyne (Thomas Friedmann) "Artificial Intelligence and it's influence to the electronics industry"	www.teradyne.com
09:20	10:00	Fa. Accretech (Dietmar Skoda) "Wafer Probing at the limits"	www.accretech.de
10:00	10:15	Kaffeepause	
10:15	10:55	Fa. Cohu (Gerhard Gschwendtberger) "Final Test Contactors for Precision Analog & RF Applications"	www.cohu.com
10:55	11:35	Fa. FormFactor (Torsten Kern) „New Dimensions: 5G development pushing Test Solutions“	www.formfactor.com

Rückfragen an:

Tel.:051777-5392

Mail: armin.lammer@infineon.com